

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Московский физико-технический институт
(государственный университет)

Оптическая микроскопия

Лабораторная работа по курсу
нанодиагностике

Выполнили: студенты 652 группы.
Нехаев А.С.

г. Долгопрудный
2019 год

Содержание

1. Введение	2
1.1. Цель работы	2
1.2. Теоретическая часть	2
1.2.1. Схема микроскопа	2
1.2.2. Методика наблюдения в отраженном свете по методу светового/темного поля	2

1. Введение

1.1. Цель работы

- 1) Ознакомление с устройством и принципом работы оптического микроскопа ВХ51М;
- 2) Определение максимального разрешения микроскопа в режимах светлого и темного поля;
- 3) Определение периода четырех структур в режимах светлого поля и дифференциально-интерференционного контраста;
- 4) Определение степени загрязнения образца в режим темного поля.

1.2. Теоретическая часть

1.2.1. Схема микроскопа

1.2.2. Методика наблюдения в отраженном свете по методу светового/темного поля

Выберите наблюдение по методу светлого (BF) или темного (DF) поля.



Установите сетевой выключатель в положение «I» (Выключено)